# Si 被注入 Gd 后的磁性及其整流特性的研究\*

周剑平 陈诺夫 宋书林 柴春林 杨少延 刘志凯 林兰英

(中国科学院半导体研究所半导体材料科学实验室 北京 100083) (2002年6月20日收到2002年10月20日收到修改稿)

采用离子束技术 在 n型硅基片中注入稀土元素钆 制备了磁性-非磁性 p-n 结.磁性层 Gd, Si1-,表现出优良的 磁学性能 ,高居里温度 ,高原子磁矩(利用 RKKY 模型可以得到解释),低矫顽力 ,并保持着半导体的属性 ,磁性-非磁性 p-n 结具有整流特性 ,但没有观察到明显的磁电阻效应.

关键词:磁性半导体,磁性 p-n结, 1的硅化物, 离子束外延 PACC: 6170T, 7550P, 7340L, 4190

# 1.引 言

稀磁半导体(diluted magnetic semiconductors, DMS)在磁性物理学和半导体物理学之间架起了一 道桥梁,不论从理论还是从应用上来说都有非常重 要的意义.由于稀磁半导体具有许多新的物理效应, 可以制成各种新型的功能器件,为一些新技术的发 展提供了条件.在稀磁半导体中,载流子和局域磁矩 之间强烈的交换作用,改变了能带结构和载流子的 行为,从中发现了许多新的物理现象,如巨法拉第效 应、大的激子分裂、巨塞曼分裂以及磁致绝缘体-金 属转变等.

对于稀磁半导体研究较多的是  $A_{1-x}$ <sup>II</sup> Mn<sub>x</sub> $B^{V}$ 和  $A_{1-x}$ <sup>III</sup> Mn<sub>x</sub> $B^{V}$ ,其中  $A^{II}$ , $B^{VI}$ , $A^{III}$ 和  $B^{V}$ 分别代表 [], V],[]],V族元素,Mn 代替部分半导体元素.但是,尽 管已经研究了几十年,还是没有能够得到应用,原因 就是其居里温度低于室温<sup>[1]</sup>及饱和磁化强度较 低<sup>[2,3]</sup>.另一种磁性和半导体相结合是过渡族元素的 硅化物,如 CrSi<sub>2</sub>,MnSi<sub>x</sub>,β-FeSi<sub>2</sub><sup>[4]</sup>等,因为 β-FeSi<sub>2</sub> 可 用做发光材料<sup>[5-7]</sup>,所以报道较多.另一方面,稀土 元素由于其不满的 4f 层电子,表现出许多特殊的物 理性质,比如掺杂到其他材料中,可用作发光材料, 磁性材料,超导材料等.对于稀土掺杂的半导体研究 较少,主要集中在研究以 Si 为基底掺杂 Er 制备成 p-n 结的发光现象和电子输运性质<sup>[8-11]</sup>.由于 Er 的 居里温度很低( $T_c = 20K$ ),对铒掺杂的磁性半导体 尚未见报道.另一种是掺杂钆元素,由于钆在硅、锗 等半导体中的固溶度很小,只有很少的报道  $Gd_xSi_{1-x}$ <sup>[12-15]</sup>,这方面的研究也仅限于 $Gd_xSi_{1-x}$ 的 金属-绝缘转变(metal-insulator transition, MIT)对载流 子浓度的依赖性和低温下的巨磁电阻效应.事实上, 钆具有高居里温度(293K)和高原子磁矩( $7.9\mu_B$ )的 优点,在硅中固溶度低的缺点可以通过制备无定形 非晶结构得到克服<sup>16]</sup>,Si在现代半导体工业中是应 用最广泛的材料,因而研究钆掺杂的磁性半导体硅 以及制备磁性-非磁性 p-n 结是很有意义的.

本文中采用低能双离子束外延技术制备,成功 地制备了在室温下具有磁性的 p-n 结,为磁性半导 体的应用提供了可能性.

### 2.实验

材料采用低能双离子束外延技术制备.该设备 具有高真空度,外延速率可以控制得很低,利用磁质 量分析器提纯,可以使离子达到同位素纯等优 点<sup>[17]</sup>.所用衬底为 n型 Si(100)基片,电阻率约为 2—4Ω·cm,经过清洗后的硅片通过机械手送入真空 室(真空度 < 1 × 10<sup>-6</sup> Pa),沉积前先对基片 800℃加 热 30min,以清除表面的氧化层.离子由 Freeman 源 电离产生,经过加速电压引出由质量分析器得到所 需的离子,减速到合适的能量,聚集后沉积到衬底

<sup>\*</sup>国家重点基础研究发展项目(批准号:C20000365,C20000683)和国家自然科学基金(批准号: 60176001)资助的课题.

上,沉积时衬底温度为室温,离子束能量为1000eV, 总计量为3×10<sup>17</sup> cm<sup>-2</sup>,沉积过程中离子束流为20— 40μA.

## 3. 结果与讨论

#### 3.1. 磁学性能



图 1 室温下测得样品的磁滞回线 (a)沉积后样品的磁滞回线(b)腐蚀后样品的磁滞回线(c)热处理后样品的磁滞回线

对于沉积的样品,用 LDJ9600 型振动样品磁强 计在室温下测量样品的磁性,该设备的灵敏度为 10<sup>-6</sup>emu,误差为 1%,测得样品的磁滞回线如图 1 (a)所示,矫顽力为 4300A/m,表现出了明显的磁性, 用 PHI-610/SAM 型 AES( Auger Electron Spectroscopy ) 测量 Gd 随深度的变化,如图 2(a)所示.在样品表



图 2 AES 的深度分布谱 (a)沉积后样品各元素百分比含量的 深度分布 (b)腐蚀后样品各元素百分比含量的深度分布

面 ,Gd 原子百分比高达 63%,随着深度增加迅速减 小,在 55nm 深处小于 5%.由于 Gd 本身在室温下具 有磁性,而且样品表面的 Gd 原子百分比很高,这样 磁性是来源于表面金属 Gd 还是磁性半导体就成为 一个问题,为了消除这种疑问,我们把样品放在 0.5% 的稀盐酸中腐蚀 15min,测得 Gd 随深度的变化 如图  $\chi$  b)所示,表面 Gd 原子百分比含量低于 20%, 随着深度增加迅速减小.腐蚀后的样品的磁滞回线 如图 1(b)所示,这时仍然具有磁性,但矫顽力太高,  $H_c = 8.8 \times 10^4$  A/m.为了降低矫顽力,把样品放在 200℃真空室中热处理 30min,可以起到弛豫压力,降 低矫顽力的作用,得到的磁滞回线如图 1(c)所示, 这时矫顽力显著降低, $H_c = 1.8 \times 10^4$  A/m. 在薄膜中没有生成新相<sup>[18]</sup>,因而我们认为磁性 来源于磁性半导体 Gd<sub>x</sub>Si<sub>1-x</sub>,利用 RKKY 模型可以 得到解释.在 RKKY 模型中,以自由的 s 电子为媒 介,磁性离子中未满的 4f 局域电子自旋之间产生间 接交换作用.离子之间交换作用的哈密顿量为

$$H_{ij} = -J_{ij}S_i \cdot S_j$$

交换积分 J<sub>ii</sub> 为<sup>[19]</sup>

$$J_{ij} = \frac{\rho(\epsilon_{\rm F})k_{\rm F}(N_0\alpha)^2}{2\pi}F(2k_{\rm F}R),$$

其中  $R = R_i - R_j$  是离子之间的距离 函数  $F(2k_F R)$  可写作

$$F(2k_{\rm F}R) = \frac{2k_{\rm F}R\cos(2k_{\rm F}R) - \sin(2k_{\rm F}R)}{(2k_{\rm F}R)^4}$$

能量积分 *J<sub>ij</sub>*依赖于载流子的能态密度<sub>f</sub>(ε<sub>F</sub>)和磁性 离子之间的平均距离,*F*(2*k<sub>F</sub>R*)随 2*k<sub>F</sub>R*周期性振 荡衰减.磁性对载流子浓度有很强的依赖性<sup>[20-22]</sup>, 在半导体中,载流子浓度远远低于金属中的浓度,这 样,长距离之间的离子就可以存在较强的相互作用, 使得磁性加强,这在实验中观察到了.根据样品的饱 和磁化强度以及磁性离子在样品中的浓度可以计算 出,平均每个钆原子磁矩约为 10<sub>μ<sub>B</sub></sub>,大于金属钆中 的原子磁矩.

#### 3.2. 载流子浓度

采用 Bio-Rad PN4300 PC 型电化学 C-V 设备测 试腐蚀后样品的载流子浓度分布,测量时腐蚀面积 为 0.1 cm<sup>2</sup>,载流子浓度随深度变化如图 3 所示,表面 的浓度接近 10<sup>20</sup> cm<sup>-3</sup>,随深度的增加,迅速减少,从 200nm 处基本在 2 × 10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> 左右,保持半导体的属 性,证实了前面的结论.而且 n 型基片由于 Gd 的注 入已变成了 p 型,这是由于钆以及其他稀土元素,表 现出和 III 族元素相同的共价性<sup>23 241</sup>,重掺杂使得基 片变为 p 型,而且说明钆已经扩散得很深,由于硅难 于腐蚀,没有能够测试到 p-n 交界处,但是对硅基片 测试的结果表明,基片确实是 n 型,载流子浓度为 n= 3 × 10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>.

3.3. 样品的整流特性

n型基片注入钆离子后,成为 p 型磁性半导体, 这样就构成了磁性-非磁性 p-n 结.经过计算,p-n 结 接触电势差  $V_{\rm D}$  = 0.82V,势垒宽度为  $X_{\rm D}$  = 200nm,由 于钆在深度方向上分布的不均匀性,载流子浓度也 不均匀,在表面附近形成了 p-p 结,其接触电势差



图 3 样品腐蚀后的载流子浓度随深度分布

 $V_{\rm D} = 0.15$ V.从而在无外场情况下,平衡时样品深度 方向的能带结构如图 4 所示.





对腐蚀后的样品,在 p 型层表面蒸发铅,在 n 型 层表面蒸发铝作为电极,电极为圆形,直径为 1.5mm 厚度为 150mm 然后进行 200℃真空热处理 30min.我们将样品放在暗室里,分别在室温和液氮 中测量了样品的 *I-V* 曲线,如图 5 所示,具有明显的 整流特征,为 p-n 结和 p-p 结共同作用的结果.但 是,对于大部分p-n结来说,在一定电流下,温度越



图 5 样品的整流特性

低,需要的电压越大,比如低温下的稀磁半导体整流 特性<sup>[25]</sup>,这和我们的实验结果正好相反,这可能是 由于表面附近的重掺杂缘故.

在同样的情况下,将样品放入 0.2T 的磁场中, 没有观察到明显的磁电阻效应.由于电子自旋和磁 场的作用,磁性-非磁性 p-n 结在磁场中会出现指数 变化的磁电阻效应<sup>[26]</sup>,但在我们的实验中没有观察 到,可能是由于外加的磁场太小的缘故.

- [1] Dietl T , Ohmo H , Matsukura F , Cibert J and Ferrand D 2000 Science 287 1019
- [2] Hayashi T , Tanaka M , Nishinaga T , Shimada H , Tsuchiya H and Otuka Y 1997 J. Crystal Growth 175/176 1063
- [3] Oiwa A, Slupinski T and Munekata H 2001 Appl. Phys. Lett. 78 518
- [4] Li X N, Nie D, Dong Ch, Ma T C, Jin X and Zhang Z 2002 Acta Phys. Sin .51 115( in Chinese ] 李晓娜、聂 冬、董 闯、马腾 才、金星、张 泽 2002 物理学报 51 115 ]
- [5] Leong D , Hanrry M , Reeson K J and Homewood K P 1997 Nature 387 686
- [6] Radermacher K, Skeide R, Carius J, Klomfass J and Mantl S 1994 Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 320 115
- [7] Giannini C , Lagopmarsino S , Scarinci F and Castrucci P 1992 Phys. Rev. B 45 8822
- [8] Bresler M S, Gusev O B, Pak P E, Yassievich I N 1999 Appl. Phys. Lett. 75 2617
- [9] Hamelin N, Kik P G, Suyver J F, Kikoin K, Polman A, Schönecker A and Saris F W 2000 J. Appl. Phys. 88 5381
- [10] Pawlak B J, Vinh N Q, Yassievich I N and Gregorkiewicz T 2001 Phys. Rev. B 64 132202
- [11] Vinh N Q ,Yassievich I V , Gregorkiewicz T 2001 Physica B 308 310 357
- [12] Teizer W, Hellman F and Dynes R C 2000 Phys. Rev. Lett. 85 848
- [13] Teizer W , Hellman F , Dynes R C 2000 Solid State Communication

# 4.结 论

本文采用离子束技术,在 n型硅基片中注入稀土 元素钆 制备了磁性-非磁性 p-n 结.经过测试,该样品 在室温具有磁性,保持着半导体的属性,具有整流特 性 这些特征,尤其是室温下具有磁性,为磁性半导体 的应用提供了可能.但是,如何将磁性和半导体属性有 机得结合起来,仍然是个值得进一步研究的问题.

114 81

- [14] Hellman F, Tran M Q, Gebala A E, Wilcox E M and Dynes R C 1996 Phys. Rev. Lett. 77 4652
- [15] Xiong P, Zink B L, Applebaum S I, Hellman F and Dynes R C 1999 Phys. Rev. B 59 R3929
- [16] Castilho J H , Chamouleyron I , Marques F C , Rettori C and Alvarez F 1991 Phys. Rev. B 43 8946
- [17] Qin F G , Wang X M , Liu Zh K , Yao Zh Y , Ren Zh Zh , Lin L Y et al 1991 Rev. Sci. Instrum. 62 2322
- [18] Zhou J P , Chen N F Zhang F Q , Song Sh L , Chai Ch L , Yang Sh Y , Liu Zh K , Lin L Y 2002 J. Crystal Growth 242 389
- [19] Ruderman M A and Kittel C 1954 Phys. Rev. 96 99
- [20] Holtzberg F, McGuire T R, Methfessil S and Suits J C 1964 Phys. Rev. Lett. 13 18
- [21] Story T, Gatazka R R, Frankel R B and Wolff P A 1986 Phys. Rev. Lett. 56 777
- [22] Dietl T, Haury A and Merle Y d'Aubigné, 1997 Phys. Rev. B 55 R3347
- [23] Mandelkorn J, Schwartz L, Broder J, Kautz H and Ulman R 1964 J. Appl. Phys. 35 2258
- [24] Strange P , Svane A , Temmerman W M , Szotek Z and Winter H 1999 Nature 399 756
- [25] Wellmann P J, Garcia J M, Feng J L and Petroff P M 1998 Appl. Phys. Lett. 22 3291
- [26] Žutić I, Fabian J and Sarma S D 2003 Phys. Rev. Lett. 88 066603

# Magnetic properties and rectifying behaviour of silicon doped with gadolinium \*

Zhou Jian-Ping Chen Nuo-Fu Song Shu-Lin Chai Chun-Lin Yang Shao-Yan Liu Zhi-Kai Lin Lan-Ying (Laboratory of Semiconductor Materials Science, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China) (Received 20 June 2002; revised manuscript received 20 October 2002)

#### Abstract

The magnetic/nonmagnetic p-n junction was prepared by implanting gadolinium into the n-type silicon with low-energy dualion-beam epitaxy technology. The magnetic layer  $Gd_x Si_{1-x}$  shows excellent magnetic properties at room temperature. High magnetic moment  $10\mu_B$  per Gd atom is observed, which is interpreted by RKKY mechanism. Magnetic/nonmagnetic p-n junctions show rectifying behaviour, but no magnetoresistance is observed.

Keywords : magnetic semiconductor , magnetic p-n junction , ion beam epitaxy , gadolinium silicides PACC : 6170T , 7550P , 7340L , 4190

<sup>\*</sup> Project supported by Special Fund for Major State Basic Research Projects (Grant Nos. G20000365 and G20000683 ) and by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60176001 ).